Search	Notes

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/814,482	FURUKAWA ET AL.
Examiner	Art Unit
David Goodwin	2818

SEARCHED					
Class	Subclass	Date	Examiner		
····					
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •					

INTERFERENCE SEARCHED					
Class	Subclass	Date	Examiner		
	l				
			<b> </b>		

SEAR (INCLUDING SE	CH NOT EARCH		)
		DATE	EXMR
257/510 506 414 418 438/427 424 435		12/13/2006	DJG
	1		
			~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	•		